X 光繞射儀
X-RAY DIFFRACTOMETER

- 儀器中文名稱：X 光繞射儀
- 儀器英文名稱：X-RAY DIFFRACTOMETER
- 儀器英文簡稱：XRD

- 儀器設備說明：

  儀器購置年月：2019 年 11 月

  廠牌及型號：Rigaku SmartLab SE

  重要規格：最大電壓 60kV，最大電流 60mA。

  低角度繞射量測。

  智慧式實驗助理功能。

  可執行 0D/1D/2D 掃描量測及定點照相。

  儀器性能：粉體晶相鑑定。

  薄膜晶相鑑定。

  低掠角 X 光繞射量測。

  殘餘應力分析。

- 服務項目：

  一般服務：測量薄膜、粉末與多晶材料之 X 光繞射光譜。

  特殊服務：經儀器指導教授認可並通過資格考試者可自行操作。

- 申請服務辦法：

  一般服務：

- 申請自行操作者，必須先取得校方 3 小時輻射核可證明，合格後授予自行操作預約資格執照。

樣品準備需知：

- 晶體試片不可大於 2×2×0.2cm，亦不可太小。
- 不接受具揮發性與毒性、空氣中強反應性之試片之粉末試樣。
- 一律用公用電腦寄電子檔，將檢測數據帶回(為維護實驗室資安，不可使用自備隨身碟)。

收費標準：請參考本系公用儀器收費相關資訊(https://che.ntu.edu.tw/che/Fee.html)

「鄭江樓貴儀儀器室」之「鄭江樓貴重儀器室儀器收費標準」(PDF 檔)。

聯絡人：

儀器指導教授：康敦彥 教授
TEL：(02) 3366-1767
E-MAIL：dunyen@ntu.edu.tw

儀器管理員：王南惠
TEL：(02) 3366-1508
E-MAIL：wangnh@ntu.edu.tw

儀器教學助教：陳又銘
TEL：(02) 3366-3069
E-MAIL：f13524068@ntu.edu.tw

資料更新日期：2026.8.6